LIS

Laboratoire d'ingé
des systèmes de Vers

# CONGRÈS NATIONAUX 2010 - 2014 DE L'ÉQUIPE INSTRUMENTATION ET MODÉLISATION DES SYSTÈMES ET NANOSYSTÈMES AVANCÉS

## Congrès nationaux avec actes et comité de lecture

### 2014

M. Tyrman, A. Pasko, O. De La Barrière, et F. Mazaleyrat, “ Étude d’aimants hexaferrites anisotropes de nouvelle génération”, Symposium de Génie Électrique SGE 2014, Cachan, juillet 2014.

F. Maroteaux, Modélisation stochastique de l'interaction chimie / turbulence de la combustion homogène Diesel : effets du temps turbulent, Congrès Français de Thermique, Lyon, juin 2014.

G. Thin, D. Hue, Z. Zojceski, OLED technology : Study for robust qualification, Salon Vision Versailles 2014.

## 2013

L. Benabou, Z. Sun, Approche continue de la rupture du bois en grands déplacements. 21ème Congrès Français de Mécanique, Bordeaux, France, 2013.

Z. Sun, L. Benabou, Modélisation de la fragilisation dynamique d'un matériau polycristallin sous traction monotone. 11ème Colloque National en Calcul des Structures, CSMA, Giens, France, 2013.

## 2012

Z. Sun, L. Benabou, P.R. Dahoo. Modélisation de la fissuration par fatigue thermomécanique de la brasure dans le module de puissance à IGBT. Journées thématiques sur la Fiabilité Mécanique des Composants électroniques, SF2M, Tours, 2012.

## 2011

M. Tixier, J. Pouget, Lois de comportement d'un polymère électro-actif, 20ème Congrès Français de Mécanique, Besançon, 29 août - 2 septembre 2011. [PDF - 118 Ko]

## 2010

L. Chassagne, P. Ruaux, S. Topsu, B. Cagneau, Y. Alayli, G. lerondel, M. Besnard, P. Sauvageot, Porte-échantillon multi-échelle pour un positionnement nanométrique en microscopie en champ proche et en lithographie, 11ème colloque international francophone Méthodes et Techniques Optiques pour l'Industrie, (Toulouse - France), CD-ROM ISBN 978-2-918241-02-7, Novembre 2010.

B. Cagneau, S. Topsu, L. Chassagne, P. Ruaux, Y. Alayli, Système pour l'étude des interactions entre nano-objets par pince laser et coulage haptique, 11ème colloque international francophone Méthodes et Techniques Optiques pour l'Industrie, (Toulouse - France), CD-ROM ISBN 978-2-918241-02-7, Novembre 2010.

A. Sinno, L. Chassagne, P. Ruaux, Y. Alayli, G. Lerondel, S. Blaize, A. Bruyant, P. Royer, Microscopie en champ proche multi-échelle : du nanomètre au millimètre, Proc 50 Colloque Interdisciplinaire en Instrumentation C2I (Le Mans - France), January 2010.